

电池冷却器性能测试，芯片温度循环试验

产品名称	电池冷却器性能测试，芯片温度循环试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

电池冷却器性能测试，芯片温度循环试验

本文介绍了SoC片上嵌入式微处理器核可测性技术的研究现状；介绍了设计时在电路中植入相关功能电路，用于提供自我测试功能的技术，以降低器件测试对自动测试设备(ATE)的依赖程度。BIST技术可以实现自我测试，也可以解决很多电路无法直接测试的问题(因为它们没有外部引脚)。

可以预见，在不久的将来即使先进的ATE也无法完全测试快的电路，这也是采用BIST的原因之一。但是BIST也存在一些缺点，如额外的电路会占用宝贵的面积，会产生额外的引脚和可能出现测试盲点等。BIST技术正成为高价ATE的替代方案，但是目前还无法完全取代ATE，他们将在未来很长一段时期内共存。

ATE

自动测试设备ATE Primer

自动测试或自动测试设备广泛用于生产测试中，以便在短的时间内完成佳测试：有几种不同类型可用。

自动测试设备，ATE包括：

ATE基础知识自动光学检测，AOI自动X射线检测，AXI在线测试，ICT功能测试，FATE开发测试策略

ATE自动测试设备是当今电子测试领域的重要组成部分。自动测试设备可以进行印刷电路板测试，并且可以非常迅速地进行设备测试 - 比手动测试设备测试速度快得多。由于生产人员的时间是电子设备项目的总生产成本的主要因素，因此必须尽可能缩短生产时间。这可以通过使用ATE，自动测试设备来实现

自动测试设备一般情况下很昂贵，因此必须确保使用正确的原理和正确的类型或方式的自动测试设备。只有正确使用适用的自动测试设备才能获得大的收益。

有多种不同的方法可用于自动测试设备。每种类型都有自己的优点和缺点，在某些情况下可以起到很好的互补作用。在选择ATE系统时，有必要全面地了解不同类型的系统并能够正确应用它们。

ATE自动测试系统的类型

可以使用各种类型的ATE系统。

当他们以各种不同的方式检测电子产品，他们通常适合生产测试周期的不同阶段。

目前使用广泛的ATE形式的自动测试设备如下：

I PCB检测系统：PCB检测是任何生产过程中的关键要素，人工检查多年前使用过，但总是不可靠和不一致。现在印刷电路板复杂得多，人工检查不是一个可行的选择。因此使用自动化系统：

I AOI，自动光学检测：广泛用于许多制造环境。它本质上是一种检查形式，是自动方式实现的。与手动检查相比，这提供了更高程度的可重复性和速度。AOI，自动光学检测，当它位于生产焊接板的生产线末端时特别有用。在这里，它可以快速定位生产问题，包括焊接缺陷，以及是否正确的组件和安装，以及他们的方向是否正确。由于AOI系统通常位于PCB焊接工艺之后，因此在太多印刷电路板受到影响之前，可以快速解决任何焊接工艺问题。

AOI自动光学检测需要一些时间来设置和测试设备以学习电路板。一旦设置，它可以非常快速和轻松地处理板。它是大批量生产的理想选择。尽管人工干预水平较低，但正确设置需要时间，并且测试系统本身也需要大量投资。
